

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ			
Nom de la prestació	Suport en microscòpia de forces atòmiques		
Descripció	- Obtenció d'imatges en mode contacte. - Obtenció d'imatges en mode no contacte. - Obtenció d'imatges en mode <i>tapping</i>. - Obtenció d'imatges en ambient líquid. - Obtenció d'imatges de forces magnètiques. - Obtenció d'imatges de fricció (força lateral). - Obtenció de gràfiques de força.		
Subunitat (secció, àrea...) i persona responsable	Secció: propietats físiques i metrologia Àrea: microscòpia Responsable: Joan Cifre Bauzà		
Altres unitats del mateix servei o d'altres serveis implicades			
Horari i calendari de prestació del servei	Horari de suport tècnic: horari laboral (8 – 15h)		
Persones destinatàries	Professors, investigadors i estudiants de màster i doctorat dels grups de recerca de la UIB. Suport a la realització de prototips mecànics i electrònics		
Requisits previs per a la prestació del servei			
Canals de prestació del servei	☒ Presencial ☐ Web	☐ Telefònic ☐ UIBdigital	☐ Correu electrònic ☐ Altres
Temps previst de tramitació	Segons reserves	Cost per a l'usuari	Consultar amb el tècnic
Informació complementària			
Normativa			
Accions que ha de realitzar la persona interessada			
Sol·licitud (com s'ha de sol·licitar, on cal adreçar-se...)	Contactar amb el tècnic responsable. Tel.: 971 17 34 85 E-mail: joan.cifre@uib.es		
Documents que cal aportar	Documents normalitzats UIB		
	Altres documents		
Altres accions			

Nom del servei i/o unitat	SCT		
Integrants del CQ que han elaborat aquest document	Joan Cifre Bauzà		
Data d'elaboració	23/06/2010	Data d'enviament al SEQUA	